

報道発表資料

2017年3月7日

テクトロニクス、OFC 2017 の展示会でデータセンタ・ネットワークの 最新光テスト・ソリューションを発表

100G、400G 規格の最新の光測定、マルチ OMA システムに対応した
業界唯一の光変調解析ソフトウェアのエンドツーエンド・デモ

テクトロニクス(所在地:東京都港区、代表取締役:木下 伸二)は、3月21日から米国カリフォルニア州で開催される [OFC 2017](#) で、米国テクトロニクスがデータセンタ・ネットワークのための最新の光テスト・ソリューションを展示することを発表します。OFC 2017 は、光通信、ネットワーク技術者のための世界最大規模の展示会です。この展示会には 600 社以上の企業が展示を行い、1,150 の技術／ビジネス・プレゼンが行われます。13,000 人以上の参加者が見込まれ、より広い帯域、データセンタのさらなる性能向上が求められる民生／事業要求に応えるための最新の光技術が展示されます。

テクトロニクス、パフォーマンス・オシロスコープ、ジェネラル・マネージャのブライアン・ライク(Brian Reich)は、次のように述べています。「100G が生産にのり、400G の設計が加速するなか、シリコンやシステム設計の特性評価、検証、デバッグにおける課題は比較できないほど増加しています。OFC でのテクトロニクス・ブースでは、高速のデータ・レートや最新の規格あるいは、最先端の研究における障害を取り除き、製品の市場投入までの時間を短縮することができる高性能なソリューションをご紹介します」

データセンタ・ネットワークの技術プロバイダは、常に容量の増加と高速データ転送の正確さを追求しています。OFC のテクトロニクス展示ブース(ブース番号:2339)では、以下のような電気／光の特性評価ソリューションを展示します。

- [DSA8300 型サンプリング・オシロスコープ](#)と 80GHz 光サンプリング・モジュールによる、最高 28GBd の NRZ、PAM4 の高感度シングルモード／マルチモード光測定を含む、IEEE 802.3bs ベースの 400G 光テスト・サポート
- [DPO70000SX シリーズ 70GHz ATI パフォーマンス・オシロスコープ](#)による、400G 規格のシングルショット PAM4 信号の解析と、ライブ・トリガ、イコライゼーション後のエラー検出
- [AWG70000 シリーズ任意波形ジェネレータ](#)、DPO70000SX シリーズ・オシロスコープと、業界唯一の光変調解析ソフトウェアによる、空間分割多重などのアプリケーションにおける [マルチ OMA システム](#) のサポートの エンドツーエンドのデモ
- 次世代の光コンポーネント、インターコネクタ製造分野に向けた画期的な新製品

テクトロニクスについて

米国オレゴン州ビーバートンに本社を置くテクトロニクスは、お客様の問題を解決し、詳細の理解を深め、新たな発見を可能にする、革新的で正確かつ操作性に優れたテスト／計測モニタリング・ソリューションを提供しています。テクトロニクスは70年にわたり電子計測の最前線に位置し続けています。

ウェブサイトはこちらから。 jp.tek.com

テクトロニクスの最新情報はこちらから

Twitter ([@tektronix_jp](https://twitter.com/tektronix_jp))

Facebook (<http://www.facebook.com/tektronix.jp>)

YouTube (<http://www.youtube.com/user/TektronixJapan>)

お客さまからのお問合せ先

テクトロニクス お客様コールセンター

TEL 0120-441-046 FAX 0120-046-011

URL jp.tek.com

報道関係者からのお問い合わせ先
テクトロニクス 広報室 瀬戸
電話: 03(6714)3097 Fax:03(6714)3667
Email: seto.atsuko@tektronix.com

Tektronix、テクトロニクスは Tektronix, Inc.の登録商標です。本文に記載されているその他すべての商標名および製品名は、各社のサービスマーク、商標、登録商標です。